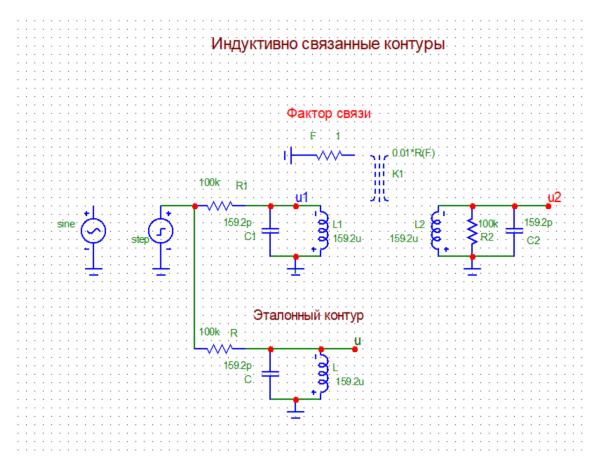
Московский Физико-Технический Институт (государственный университет)

Работа 20

Сибгатуллин Булат, ФРКТ

1 Система с индуктивной связью

1. Откроем файл 2LCM.CIR, изучим схему данной системы с индуктивной связью.



- 2. Оставим только **плот 2** просто частотные характеристики схемы. Посмотрим на поведение схемы при варьировании параметров контуров при критической связи.
- 3. Изучим поведение резонансных кривых и фазовых характеристик при F = [0.2, 1|0.2] и F = [1, 5|1].

Измерим границы диапазонов изменения фаз на первом и втором контурах:

На первом контуре - от -84.161^{circ} до 84.415^{circ} , на втором контуре - от -258.322^{circ} до -78.322^{circ} ,

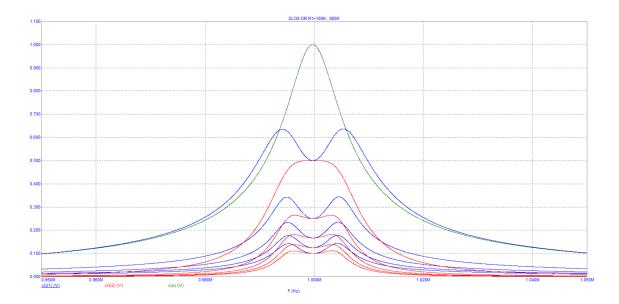


Рис. 1: $R_1 = [100k, 900k|200k], R_2 = 100k$

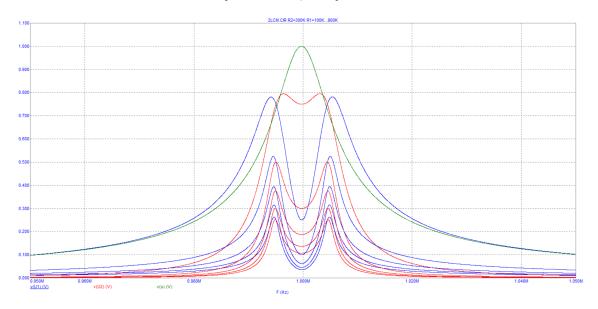


Рис. 2: $R_1 = [100k, 900k|200k], R_2 = 300k$

А также разность фаз между напряжениями на контурах на частоте $f_0:89.238^{circ}.$

Измерив уровни $u_1(f_0),\,u_2(f_0)$ при F=0.5;1;2, проверим формулы:

$$u_1(f_0) = \frac{1}{1+F^2}, \ u_2(f_0) = \frac{F}{1+F^2}$$
 (1)

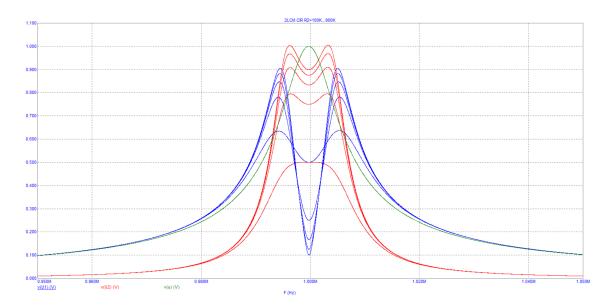


Рис. 3: $R_1 = 100k, \ R_2 = [100k, 900k|200k]$

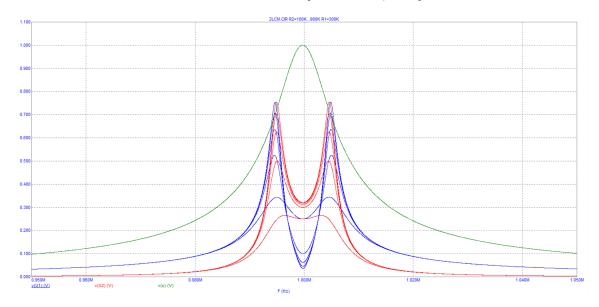


Рис. 4: $R_1 = 300k, \ R_2 = [100k, 900k|200k]$

F	1	0.5	2
$u_1(f_0)_{\mathfrak{S}_{\mathrm{KCII}}}$	0.5	0.8	0.2
$u_1(f_0)_{\text{reop}}$	0.5	0.8	0.2
$u_2(f_0)_{_{\mathfrak{I}KC\Pi}}$	0.5	0.4	0.2
$u_2(f_0)_{\text{reop}}$	0.5	0.4	0.4

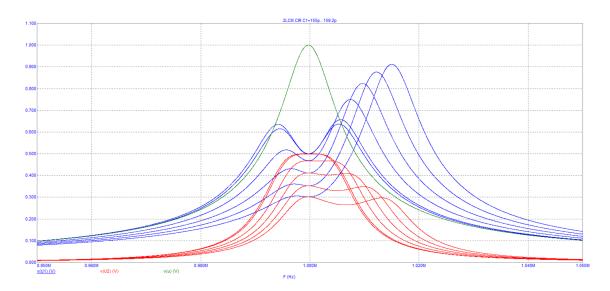


Рис. 5: $R_1 = 100k$, $R_2 = 100k$, $C_1 = [155p, 159, 2p|1p]$

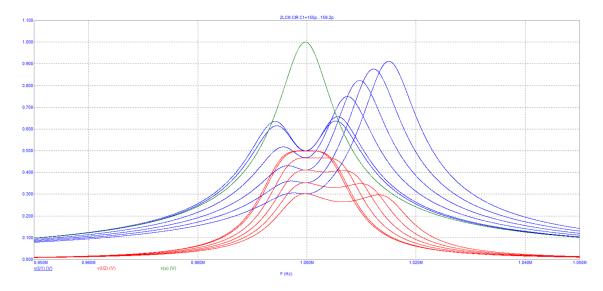


Рис. 6: $R_1 = 100k, \ R_2 = 100k, \ C_2 = [155p, 159, 2p|1p]$

Формула (1) выполняется.

4. Измерим значения F, при которых возникает: а) провал на первом контуре: $F \approx 0.55$, b) провал на втором контуре: F > 1, c) подъем на фазовой характеристике первого контура: F > 1.

Измерив частоты пересечения нуля фазовой характеристикой u_1 при F=5 ($\nu=976.121k,1.001M,1.025M$) и при F=10 ($\nu=$

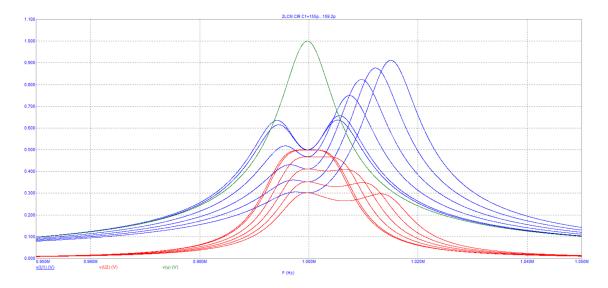


Рис. 7: $R_1 = 100k$, $R_2 = 100k$, $C_1 = [159, 2p, 165p|1p]$

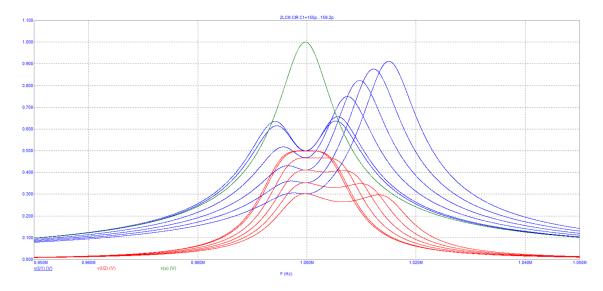


Рис. 8: $R_1 = 100k$, $R_2 = 100k$, $C_2 = [159, 2p, 165p|1p]$

953.430k, 1.005M, 1.054M), проверим приближённые $(f_0 \pm FF_0)$ и уточнённые $(f_0 \sqrt{1 \pm \frac{F}{Q}})$.

5. Оставим только плот 1. При критической связи измерим ширину полосы по уровню -3dB эталонного контура ($\triangle f = 10.273k$) и ширину полосы по уровню -9dB резонансной кривой на втором контуре ($\triangle f = 14.279k$). Убедимся, что их отношение составляет $\sqrt{2}$.

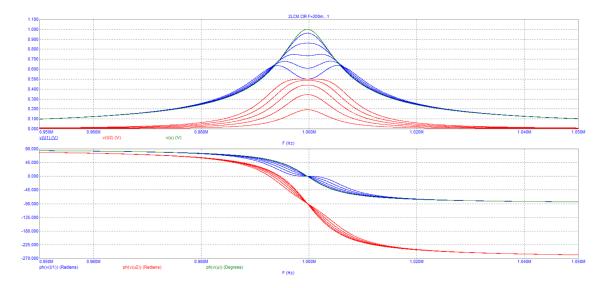


Рис. 9: F = [0.2, 1|0.2]

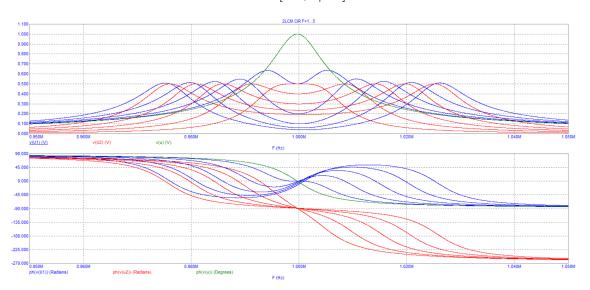


Рис. 10: F = [1, 5|1]

Измерим уровни затухания критической кривой при сдвигах по частоте на декаду F_0 , то есть на $\pm 10F_0 = \pm 50k$ (затухание - $-34\frac{dB}{\text{дек}_{F_0}}$). Варьируя сопротивление потерь эталонного контура R = [60k, 80k|5k], выясним, что при добротности Q = 68.6 ($R = 70k, \triangle f = 14.557k$) его полоса сравнивается с полосой двухконтурной системы. Измерим затухание, вносимое эталонным котуром с этой добротостью при расстройках на декаду F_0 (затухание - $-16.7\frac{dB}{\text{дек}_{F_0}}$). Оценим

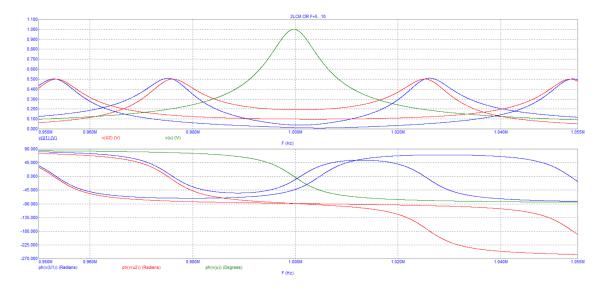


Рис. 11: F = [5, 10|5]

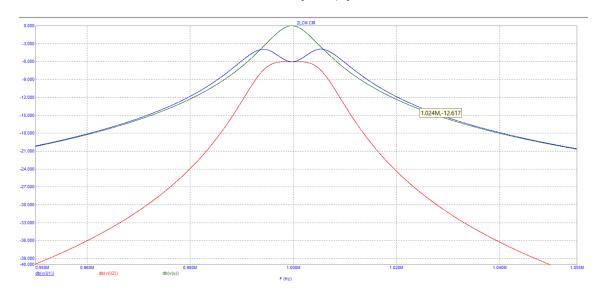


Рис. 12: Схема с начальными характеристиками

выигрыш двухконтурной системы по затуха- нию: выигрыш $\simeq 2$ раза.

6. Изучим поведение резонансных кривых при F = [0.5, 1|0.1]. Найдём значение F = [0.65, 0.75|0.05], при котором полоса двухконтурной системы по критическому уровню -9dB сравнивается с полосой 10k эталонного контура: F = 0.75. При этом значении F оценим

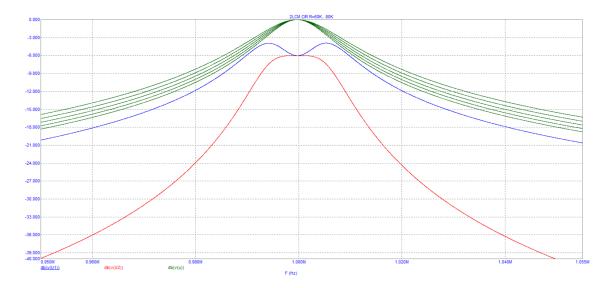


Рис. 13: = [60k, 80k|5k]

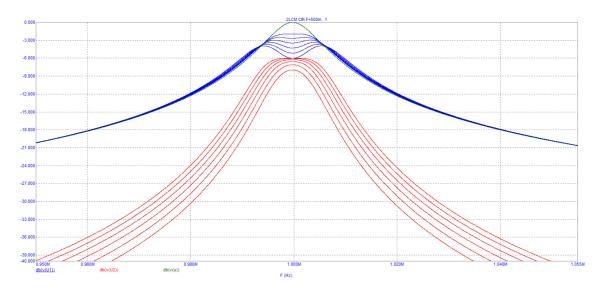


Рис. 14: F = [0.5, 1|0.1k]

выигрыш по затуханию при расстройке на декаду F_0 двухконтурной системы по сравнению с эталоном: у эталона - $-19.75\frac{dB}{\text{дек}_{F_0}}$, у двухконтурной системы - $-36.45\frac{dB}{\text{дек}_{F_0}}$ \Longrightarrow выигрыш ≈ 2 раза.

7. Измерим значение F из диапазона F=[2.2,2.6|0.1], при котором провал во втором контуре касается сверху критического уровня - 9dB. F=2.4: при этом значении F измерим ширину полосы $\Delta\omega$

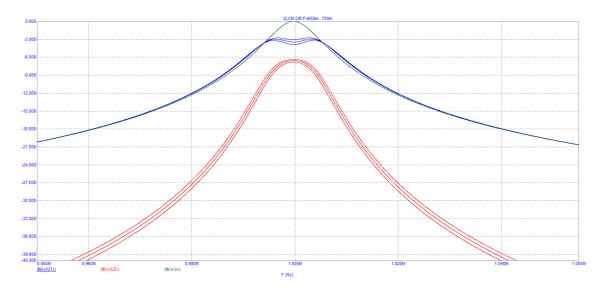


Рис. 15: F = [0.65, 0.75|0.05]

двухконтурной системы по уровню -9dB ($\triangle\omega$) и уровни затухания при расстройках на декаду F_0 (у эталона - $-20\frac{dB}{\text{дек}}$, у двухконтурной системы - $-23\frac{dB}{\text{дек}}$). Варьированием сопротив- ления эталонного контура R добьёмся совпадения его полосы с полосой двухконтурной системы и измерим уровни затухания, вносимого контуром ($-18.322\frac{dB}{\text{дек}}$). (R=140k).

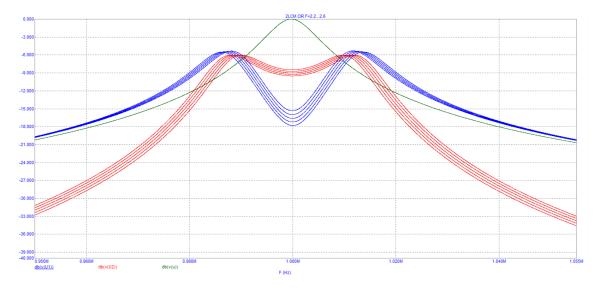


Рис. 16: F = [2.2, 2.6|0.1]

8. Изучим зависимость уровней затухания от F = [1, 5.5|1.5]. Занесём результаты в таблицу 2.

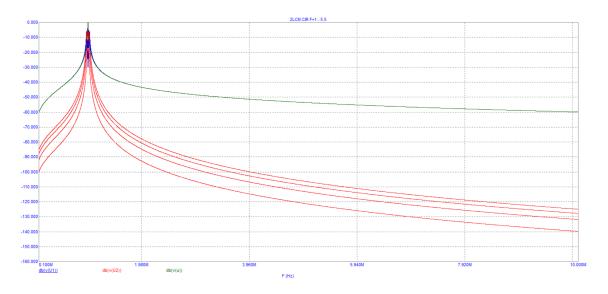


Рис. 17: F = [1, 5.5|1.5]

F	f = 100k	f = 10 Meg
1	-94	-133
2.5	-85	-126
4	-82	-122
5.5	-79	-119

Установим добротность эталонного контура равной $\frac{Q}{\sqrt{2}}$ (сопротивление потерь R=[70k,70k|1k]), оценим выигрыш в затухании двухконтурной системы с F=1 по сравнению с эталонным контуром с той же шириной полосы. Он равен $f=100k\Rightarrow 40\frac{dB}{\text{дек}},\, f=10Meg\Rightarrow 80\frac{dB}{\text{дек}}.$

9. Включим плоты 2 и 4 - частотные характеристики и графики вносимых проводимостей. Снимем зависимость пиковых значений вещественной и мнимой частей вносимой проводимости от F=[0.5,1|0.5] и F=[1,2|1]. Проверим формулу $Re(Y)=\frac{F^2}{Q_{\rho}}$.

F	Im	Re
2	200k	400k
1	50k	100k
0.5	12,5k	25k

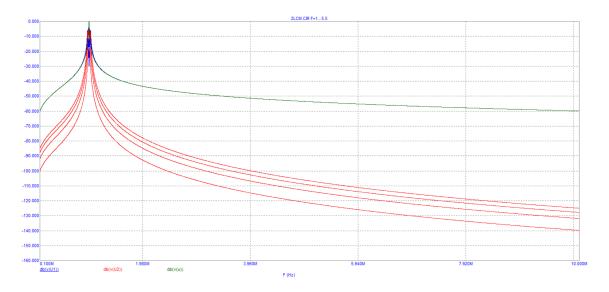


Рис. 18: R = [70k, 70k|1k], Q = 70, F = 1

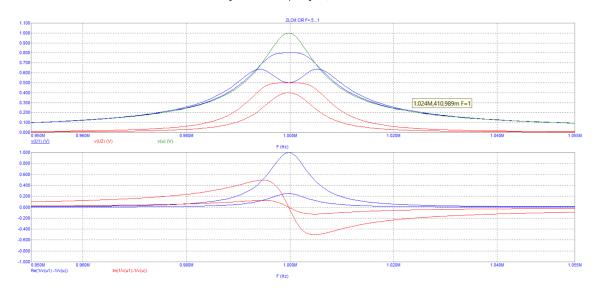


Рис. 19: F = [0.5, 1|0.5]

Оценим значения вносимых емкостей εC при F=0.5,1,2, зная, что:

$$\omega \varepsilon C \simeq \frac{\varepsilon}{\rho} = \frac{\varepsilon}{1k}$$

а уровень на графике дает значение в 100ε .

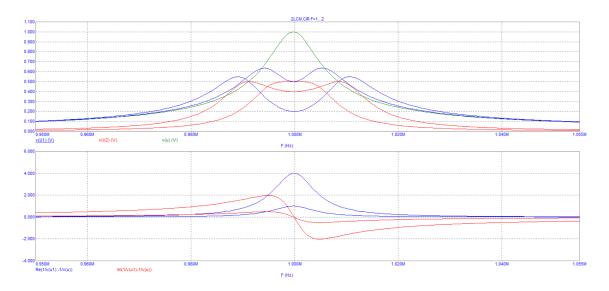


Рис. 20: F = [1, 2|1]

F	εC
0.5	12.5ε
1	50ε
2	$200 \ \varepsilon$

10. В режиме Transient проанализируем переходные характеристики до напряжений на первом и втором контурах при F=1.

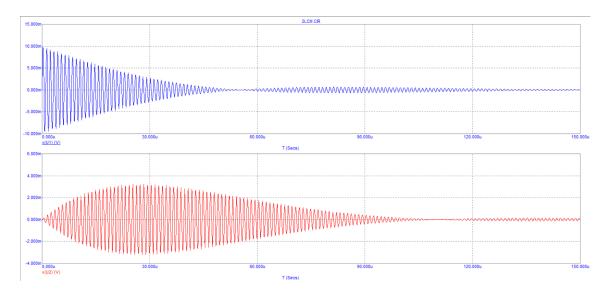


Рис. 21: F = 1

Установим F=0.1. Измерим постоянную времени τ экспоненциального спада огибающий напряжения $u_1\sim e^{-t/\tau}$ до уровня $\frac{1}{e}=0.37$. $\tau\simeq=34$ мкс. Следовательно выполняется соотношение:

$$\tau \frac{\pi}{2\pi F_0} \simeq 32\mu$$

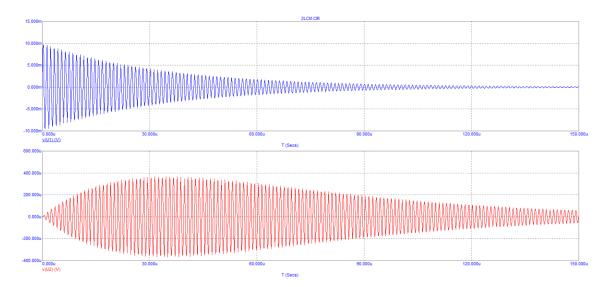


Рис. 22: F = 0.1

Задавая поочередно значения F=1;2;4;8, снимем зависимость от F частоты биений.

F	1	2	4	8
$\tau/2$, MKC	108	55	27.5	13.5
ν , к Γ ц	4.6	9.1	18.2	37
FF_0 , к Γ ц	5	10	20	40

11. Установив диапазон моделирования [2Meg, 600k], исследуем частотные и фазовые характеристики при сильной связи, варьируя F = [10, 70|10].

Измерим частоты f_{\pm} пиков при F=50. $f_{+}=1,414M,$ $F_{-}=816,378k.$ Убедимся в правильности формулы:

$$f_{\pm} = \frac{f_0}{\sqrt{1 \pm k}}$$

Убедимся в том, что при $F \longrightarrow 100$ частота одного пика стремится к $\frac{f_0}{\sqrt{2}}$, а второго уходит в бесконечность.

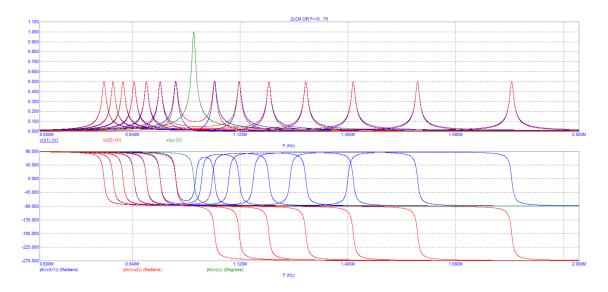


Рис. 23: F = [10, 70|10]

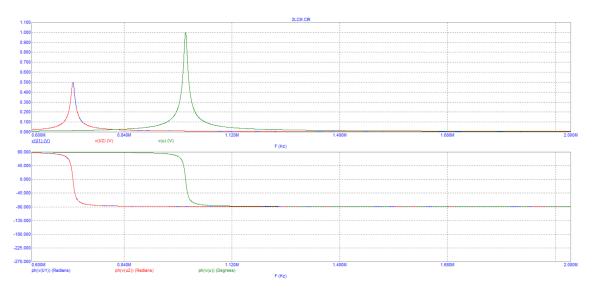
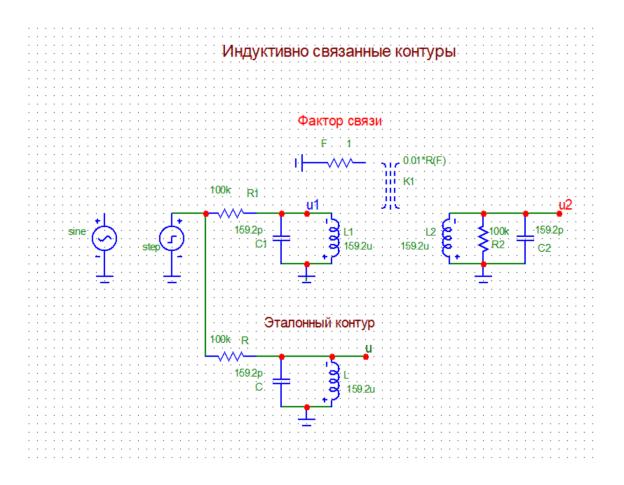


Рис. 24: $F \longrightarrow 100$

2 Система с емкостной связью

1. Откроем модель 2LCC.CIR.

Проанализируем поведение частотных и фазовых характеристик при варьировании F=[1,4|1]. Соспоставим результаты наблюдений с картой полюсов/нулей на рис.11 в методичке.



Измерим диапазоны изменения фазовых характеристик на первом и втором контурах.

На первом: от 90° до $−90^{\circ}$.

На втором: от -90° до -450° .

Измерим значения F, при которых:

- а) возникает провал на первом контуре F = 0.5
- b) провал на втором контуре F = 1
- с) подъем на фазовой характеристике первого контура F=1

Снимем зависимость частоты провала на втором контуре от F = [2,4|1]:

F	2	3	4
$f_{\text{пров}}$, Γ ц	990k	985k	980k

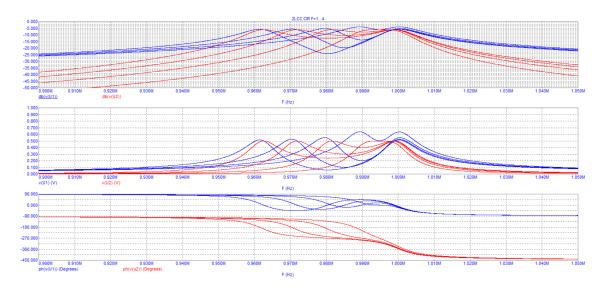


Рис. 25: F = [1, 4|1]

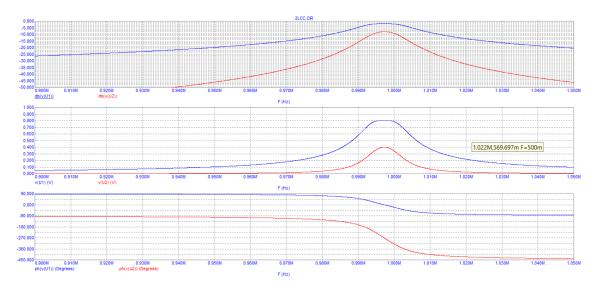


Рис. 26: F = 0.5

2. Откроем график частотных характеристик в децибелах. Исследуем их изменение при варьировании F=[1,4|1]. Измерим уровни затухания при расстройках $\pm 50k$ (на декаду полосы контура).

F	1 контур, $\frac{dB}{\text{дек}}$	2 контур, $\frac{dB}{\text{дек}}$
1	-20	-39.6
2	-19.5	-34.2
3	-19	-27.9
4	-18	-26

Перейдем на частотный диапазон [10Meg,100k] и измерим уровни затухания при расстройках на декаду f_0 :

F	1 контур, $\frac{dB}{\text{дек}}$	2 контур (100k), $\frac{dB}{\text{дек}}$	2 контур (10Meg), $\frac{dB}{\text{дек}}$
1	-60	-140	-101
2	-60	-133	-95
3	-60	-129	-91
4	-60	-127	-89

3. Изучим переходные характеристики при значениях F=0.1;2;3;4. Убедимся в их сходстве с характеристиками системы с индуктивной связью.

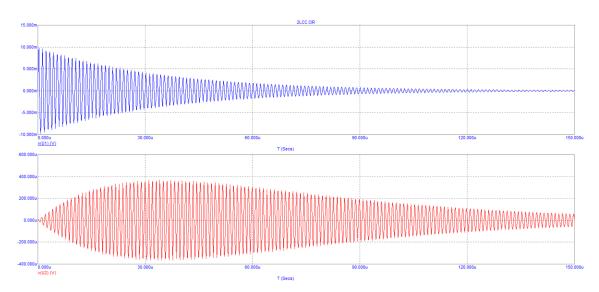


Рис. 27: F = 0.1

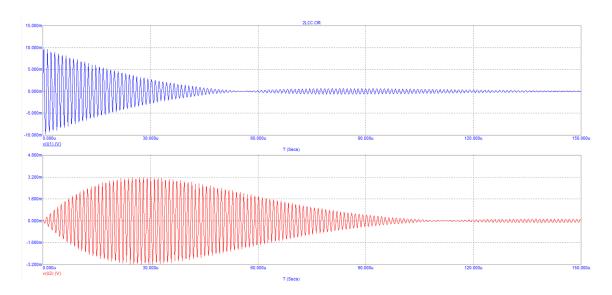


Рис. 28: F = 1

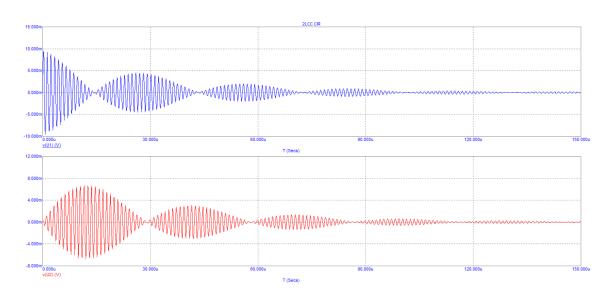


Рис. 29: F = 4